

Unión Particular para la Clasificación Internacional de Patentes (Unión de la CIP) Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP

**Cuadragésima séptima reunión
Ginebra, 9 a 13 de mayo de 2022**

INFORME

aprobado por el Grupo de Trabajo

INTRODUCCIÓN

1. El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP (en lo sucesivo, “el Grupo de Trabajo”) celebró su cuadragésima séptima reunión en Ginebra del 9 al 13 de mayo de 2022. Estuvieron representados en la reunión los siguientes miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumanía, Suecia, Suiza, Ucrania, la Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), la Oficina Europea de Patentes (OEP) (27). Hungría, la India y Singapur estuvieron representados en calidad de observadores. La lista de participantes figura en el Anexo I del presente informe.

2. Inauguró la reunión el Sr. O. Steinkellner, presidente del Grupo de Trabajo.

3. El Sr. K. Natsume, subdirector general del Sector de Infraestructura y Plataformas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dio la bienvenida a los participantes.

MESA

4. La Sra. N. Xu (OMPI) desempeñó las funciones de secretaria.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5. El Grupo de Trabajo aprobó por unanimidad el orden del día revisado, que figura en el Anexo II del presente documento con algunas modificaciones.

DEBATES, CONCLUSIONES Y DECISIONES

6. Con arreglo a lo decidido por los órganos rectores de la OMPI en su décima serie de reuniones, celebrada del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1979 (véanse los párrafos 51 y 52 del documento AB/X/32), en el informe de la presente reunión se recogen únicamente las conclusiones del Grupo de Trabajo (decisiones, recomendaciones, opiniones, etc.) pero no se recogen, en particular, las declaraciones formuladas por los participantes, excepto en los casos en que se haya expresado una reserva en relación con determinada conclusión del Grupo de Trabajo o se haya repetido una reserva tras alcanzar dicha conclusión.

INFORME DE LA QUINGUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS DE LA CIP

7. El Grupo de Trabajo tomó nota de un informe verbal de la Secretaría sobre la quincuagésima tercera sesión del Comité de Expertos de la CIP (en adelante, "el Comité") (documento IPC/CE/53/2).

8. El Grupo de Trabajo tomó nota de que el Comité expresó gran satisfacción por el trabajo de revisión realizado por el Grupo de Trabajo, en particular, durante los últimos años de la pandemia de Covid-19. El Comité alentó a las oficinas a participar activamente en el programa de revisión de la CIP, en particular, presentando peticiones de revisión en el marco de la hoja de ruta de revisión de la CIP y de las nuevas tecnologías emergentes.

9. El Grupo de Trabajo tomó nota asimismo de que el Comité acordó dar instrucciones al Grupo de Trabajo para que considere una forma de trabajo mejorada y más equilibrada entre sus reuniones anuales con respecto a la finalización del número de "grandes" proyectos de revisión, por ejemplo, aplicando un enfoque centrado en cada caso, en coordinación entre los ponentes, la Oficina Internacional, así como los propietarios de la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC), la OEP y los Estados Unidos de América.

10. Se observó que el Comité también examinó el posible formato de las futuras reuniones del Grupo de Trabajo e hizo hincapié en la importancia de la participación física para ayudar a resolver cuestiones complejas, promover un intercambio eficaz de opiniones y ofrecer la oportunidad de mantener debates informales necesarios durante las pausas, al tiempo que se mostró partidario de que siga siendo posible la participación a distancia para permitir una participación más amplia. Asimismo, el Comité abordó la importancia de intensificar el uso del foro electrónico de la CIP en combinación con el formato híbrido de las reuniones del Grupo de Trabajo.

11. Además, se tomó nota de que el Comité extendió su gratitud a la OEP, a la Oficina principal y todas las Oficinas miembros del Grupo de especialistas en tecnologías de semiconductores (EGST), por la enorme labor realizada hasta ahora, sobre todo, con respecto a la puesta en marcha del primer lote de proyectos C en el foro electrónico de la CIP, así como durante los últimos años de la pandemia de Covid-19.

12. El Grupo de Trabajo tomó nota además de que el Comité había aprobado modificaciones en la Guía de la CIP y las Directrices para la revisión de la CIP y, concretamente, decidió que debe evitarse en la medida de lo posible el uso de marcas en la CIP y modificó en consecuencia el párrafo 29 de las Directrices.

INFORME DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 1 DE LAS OFICINAS DE LA COOPERACIÓN PENTALATERAL – GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CLASIFICACIÓN

13. El Grupo de Trabajo tomó nota de un informe verbal de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), en nombre de las cinco Oficinas de la Cooperación Pentalateral (en adelante, "las

Oficinas IP5"), sobre la vigésima segunda reunión del Grupo de Trabajo de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral sobre la Clasificación (IP5 WG1).

14. Se tomó nota de que, durante la vigésima segunda reunión del IP5 WG1, las cinco Oficinas acordaron promover cuatro proyectos de cooperación pentilateral (proyectos F) a la fase de la CIP. La JPO, en nombre de las Oficinas IP5, ha publicado en el foro electrónico, en el marco del proyecto [CE 456](#), las listas actualizadas de todos los proyectos y propuestas en curso de las Oficinas IP5 (véase el anexo 39 del fichero del proyecto) con el fin de evitar el solapamiento entre las peticiones de revisión de la CIP y las actividades de revisión en curso de las Oficinas IP5.

15. Además, el Comité tomó nota de que las Oficinas IP5 examinaron la iniciativa de clasificación de las tecnologías relacionadas con las nuevas tecnologías emergentes y la inteligencia artificial (NET/AI).

PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA CIP

16. El Grupo de Trabajo examinó 22 proyectos de revisión, a saber: [C 505](#), [C 508](#), [C 509](#), [C 510](#), [C 511](#), [C 512](#), [C 513](#), [C 520](#), [C 521](#), [C 522](#), [C 523](#), [C 524](#), [F 071](#), [F 082](#), [F 089](#), [F 122](#), [F 138](#), [F 141](#), [F 142](#), [F 143](#), [F 149](#), [F 151](#), [F 152](#), [F 156](#), [F 157](#), [F 158](#), [F 159](#), [F 161](#), [F 162](#), [F 163](#) y [F 164](#)

17. En el foro electrónico, dentro de los correspondientes proyectos, se indica la situación de los proyectos mencionados, junto con la lista de las medidas futuras y los plazos. Todas las decisiones, observaciones y anexos técnicos están disponibles en los anexos denominados "Decisión del Grupo de Trabajo" de los proyectos correspondientes que figuran en el foro.

18. El Grupo de Trabajo aprobó 21 proyectos de revisión, seis de los cuales se completaron con respecto a las modificaciones del esquema y modificaciones de la definición, si procede, a saber, los proyectos [C 521](#), [F 151](#), [F 152](#), [F 159](#), [F 161](#) y [F 162](#), respecto de los que entrarán en vigor las modificaciones del esquema y la definición en la versión 2023.01 de la CIP, mientras que se completaron únicamente las modificaciones del esquema con respecto a 11, a saber, los proyectos [C 505](#), [C 508](#), [C 509](#), [C 510](#), [C 511](#), [C 512](#), [C 513](#), [F 138](#), [F 141](#), [F 156](#) y [F 164](#), que entrarán en vigor en la versión 2023.01 de la CIP. Mientras tanto, cuatro de los 21 proyectos se completaron con respecto a las definiciones a fin de que se integren en la versión 2023.01 de la CIP, a saber, los proyectos [F 071](#), [F 089](#), [F 122](#) y [F 149](#), mientras que el Grupo de Trabajo había completado en sus reuniones anteriores las modificaciones del esquema.

19. El Grupo de Trabajo felicitó al EGST por la aprobación final de las modificaciones del esquema del primer lote de proyectos relacionados con los semiconductores, a saber, [C 510](#), [C 511](#), [C 512](#) y [C 513](#), y su integración en la CIP 2023.01. El Grupo de Trabajo expresó agradecimiento a la OEP, a la oficina principal del EGST, y a todas las oficinas miembros del EGST por el gran esfuerzo realizado hasta la fecha, así como a las oficinas por su activa participación en el examen de dichos proyectos. El Grupo de Trabajo espera recibir pronto el siguiente lote de proyectos de revisión del EGST.

MANTENIMIENTO DE LA CIP

20. El Grupo de Trabajo examinó 12 proyectos de mantenimiento, a saber: [M 627](#), [M 633](#), [M 634](#), [M 811](#), [M 812](#), [M 814](#), [M 815](#), [M 817](#), [M 818](#), [M 819](#), [M 820](#) y [M 821](#).

21. En el foro electrónico, dentro de los correspondientes proyectos, se indica la situación de los proyectos mencionados, junto con la lista de las medidas futuras y los plazos. Todas las decisiones, observaciones y anexos técnicos están disponibles en los anexos denominados "Decisión del Grupo de Trabajo" de los proyectos correspondientes que figuran en el foro.

22. El Grupo de Trabajo completó ocho proyectos de mantenimiento con respecto a modificaciones del esquema o la definición, que se integrarán en la CIP 2023.01, a saber, [M 627](#), [M 633](#), [M 634](#), [M 811](#), [M 818](#), [M 819](#), [M 820](#) y [M 821](#).

23. El Grupo de Trabajo acordó crear siete nuevos proyectos de mantenimiento, a saber:

Química: M 822 (A23B, A23C, A23L, ponente - OEP) - procedente del proyecto [M 812](#);

M 823 (B01J, ponente - OEP) - procedente del proyecto [C 520](#);

Electricidad: M 824 (H01M, ponente - OEP) - procedente del proyecto [F 082](#);

M 826 (G03B, H04N, ponente - Reino Unido) - procedente del proyecto [C 505](#);

M 827 (G10L, ponente - Alemania) - procedente del proyecto [M 633](#);

M 828 (G01K y G01M, ponente - Canadá) - procedente del proyecto [M 633](#); y

Independiente: M 825 (ponente - Irlanda) - procedente del proyecto [C 510](#).

SITUACIÓN DE LA SUPRESIÓN DE REFERENCIAS NO LIMITATIVAS DE LOS PROYECTOS M 200 A M 500

24. El debate se basó en un informe de situación, elaborado por la Oficina Internacional, relativo a los proyectos de mantenimiento para la supresión de las referencias no limitativas del esquema de la CIP (anexo 42 del fichero del proyecto [WG 191](#)).

25. El Grupo de Trabajo tomó nota de que, entre los 23 proyectos activos, se ha llegado a un acuerdo sobre los 12 proyectos siguientes en los debates mantenidos en el foro electrónico, por lo que esos proyectos pueden considerarse finalizados. Las correspondientes modificaciones del esquema y las definiciones se incluirían en la CIP 2023.01.

M 223	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase B01L (ponente - US)
M 241	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase B03C (ponente - US)
M 242	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase C09C (ponente - US)
M 243	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase C23C (ponente - US)
M 244	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase D01C (ponente - US)
M 254	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase H02B (ponente - US)
M 255	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase H02G (ponente - US)
M 257	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase E04H (ponente - US)
M 258	Supresión de las referencias no limitativas en la clase A41 (ponente - US)
M 260	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase G10H (ponente - US)
M 261	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase G10K (ponente - US)
M 266	Supresión de las referencias no limitativas en la subclase A21C (ponente - IL).

26. El Grupo de Trabajo tomó nota, con gratitud, de que el Reino Unido y Suecia se ofrecieron como ponentes para la supresión de referencias no limitativas, respectivamente, en la subclase B64G y en todas las subclases de las clases F22 y F27, a saber, los proyectos M 267 (B64G, ponente - GB), M 268 (F22, ponente - SE) y M 269 (F27, ponente - SE).

27. La Secretaría indicó que en el fichero del proyecto [WG 191](#) se publicará un cuadro con un resumen actualizado de la situación relativa a la supresión de referencias no limitativas del esquema.

PRÓXIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

28. Tras evaluar el volumen de trabajo previsto para su siguiente reunión, el Grupo de Trabajo convino en dedicar los dos primeros días y medio al ámbito de la electricidad, la tarde siguiente y la mañana siguiente al ámbito de la química y el último día y medio al ámbito de la mecánica.

29. El Grupo de Trabajo tomó nota de las siguientes fechas provisionales para su cuadragésima octava reunión:

7 a 11 de noviembre de 2022

30. El Grupo de Trabajo aprobó por unanimidad el presente informe por medios electrónicos el 3 de junio de 2022.

[Siguen los Anexos]

LISTE DES PARTICIPANTS/**LIST OF PARTICIPANTS****I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES**

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French)

ALLEMAGNE/GERMANY

Armin BARTHEL (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Elisabeth ESSEL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich

Martina FRITZSCHE-HENKE (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Justus Sebastian KRUSE (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Steffen MÜNCH (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich,

Alessandra SANI (Ms.), Senior Adviser, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Thomas SCHENK (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Florian SIEBEL (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Michaela Katja STANGL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Oliver STEINKELLNER (Mr.), Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Veronika TINKL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Abdulahakim ALSAEED (Mr.), Senior Examiner, IP Operations Patents / Mechanical Engineering Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Fahad ALNAFJAN (Mr.), Patents Expert, Patents Directorate, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Rawabi ALMUHIMED (Ms.), Patent Examination Specialist, Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Abdulahakim ALSAEED (Mr.), Senior Examiner, IP Operations, Patents/ Mechanical Engineering Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Abdullah ALGHAMDI (Mr.), Patents Expert, Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Faisal Saihan S. ALOTAIBI (Mr.), Senior IP Information Analyst, IP Information Center, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Lloyd JAMES (Mr.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra
Markus KLAIBER (Mr.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra
Deb MCDONNELL (Ms.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Melbourne
Alex SIMMONS (Mr.), Patent Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra
Mu-En TIEN (Mr.), Patent Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra

BRÉSIL/BRAZIL

Darcio GOMES PEREIRA (Mr.), National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Campinas, São Paulo, Brazil
Tatielli BARBOSA (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro
Maria Raquel CATALANO DE SOUSA (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro

CANADA

Nancy BEAUCHEMIN (Ms.), gestionnaire de programme - International CIB/CPC, Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO) - Direction des brevets, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Gatineau

CHINE/CHINA

LI Xiao (Ms.), Senior Program Administrator, Patent Documentation Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
DONG Qian (Ms.), Deputy Divisional Director, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
LI Bo (Ms.), Divisional QC Manager, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
NAN Nan (Mr.), Examiner, Patent Examination Cooperation Beijing Center, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
TONG Jingyi (Ms.), Examiner, Patent Examination Cooperation Beijing Center, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
DONG Yan (Ms.), Program Administrator, Patent Documentation Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

ESPAGNE/SPAIN

Elena PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, División de física y de patentes eléctricas, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (OEPM), Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Tiina LILLEPOOL (Ms.), Principal Examiner, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

William BREWSTER (Mr.), Supervisor Patent Classifying, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Matthew BROOKS (Mr.), Supervisory Patent Classifier - Mechanical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Jill GRAY (Ms.), Patent Classifier - Chemical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Chris JETTON (Mr.), Mechanics Classifier, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Gustavo LOPEZ (Mr.), Patent Classifier - Electrical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Yasmine FULENA (Ms.), IP Advisor, USUN Geneva, Geneva

Marina LAMM (Ms.), IP Attaché, USUN Geneva, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Vladislav MAMONTOV (Mr.), Head, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property - Rospatent, Moscow

Lada TSIKUNOVA (Ms.), Deputy Head, IPC, Federal Service for Intellectual Property - Rospatent, Moscow

FINLANDE/FINLAND

Hanna AHO (Ms.), Head of Division, Patents and Trademarks, Mechanical and Civil Engineering, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Helsinki

FRANCE

Magalie MATHON (Mme), examinatrice en charge de mission CIB, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

David DURIEZ (M.), expert en chimie, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Géraldine VENTORUZZO (Mme), expert en électricité, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Carole BREMEERSCH (Mme), conseillère propriété intellectuelle, Pole économique, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Patent Examination, Intellectual Property Office of Ireland, Department of Enterprise, Trade and Employment, Kilkenny

ISRAËL/ISRAEL

Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

JAPON/JAPAN

Sumio MIGITA (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Satoshi ABE (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kotaro FUJISHIMA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Shota HOSOKAWA (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Michiru MIURA (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kazuhide NAKANO (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Ayano NISHITA (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yuto NISHIZUKA (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yusuke OKATANI (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Toshinori OTSUKA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Takuya YASUI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of Japan, Permanent Mission, Geneva

MEXIQUE/MEXICO

Kevin Uriel ALENCASTER VILLA (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of International Affairs, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Pedro Christian AYALA ROSALES (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Ayari FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Miguel GONZALEZ AGUILAR (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Diana HEREDIA GARCÍA (Sra.), Divisional Director, Divisional Direction of International Affairs, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Gustavo JARAMILLO NAVARRETE (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Ciudad de México

Alicia MARMOLEJO FLORES (Sra.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Pablo ZENTENO MARQUEZ (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Hosanna MORA GONZÁLEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

NORVÈGE/NORWAY

Bente AARUM-ULVÅS (Ms.), Senior Examiner, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Robert SCHOUWENAARS (Mr.), Technical Advisor, Netherlands Patent Office, Ministry of Economic Affairs, The Hague

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

PARK Sungchul (Mr.), Deputy Director, Patent Legal Administration Division, Daejeon

Wangseok LEE (Mr.), Head of Group, IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

CHA HyunSoo (Mr.), Research Engineer, IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

JUNG Juhee (Ms.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

KIM Joohyeok (Mr.), Research Engineer, IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

LEE Jaehoen (Mr.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

PARK Hyunchul (Mr.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

YOON Inseok (Mr.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

LEE Jinyong (Mr.), IP Attache, Economy, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information, Industrial Property Office of the Czech Republic, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Florica ENEA (Ms.), Examiner and Head of Department, Electrical Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Ana PREJBEANU (Ms.), Examiner, Formal Examination, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeremy COWEN (Mr.), Senior Patent Examiner - Classification, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Patrick PURCELL (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

William (Bill) RIGGS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Huw THOMAS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Rhys WILLIAMS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

SUÈDE/SWEDEN

Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

Tomas LUND (Mr.), Senior Patent Examiner, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Philippe TATASCIORE (M.), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Michael STALDER (M.), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Charlotte BOULAY (Mme), Legal Advisor, Division of Legal and International Affairs, Swiss Federal Institute of Intellectual Property, Bern

UKRAINE

Bohdan PADUCHAK (Mr.), Deputy Director, Department for Intellectual Property, Ministry of Economy of Ukraine, Kyiv

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

HONGRIE/HUNGARY

Ildikó DIÓSPATONYI (Ms.), Patent Examiner, Pharmaceuticals and Agriculture Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

Zsuzsanna TÖRŐCSIK (Ms.), Patent Examiner, Chemistry and Biotechnology Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

A. Seetha Raman (Mr.), Examiner of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Chennai

Saurabh DWIVEDI (Mr.), Examiner of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Kolkata

Vishakha GUPTA (Ms.), Examiner of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi

SINGAPOUR/SINGAPORE

Ning DU (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Lei HONG (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Cheow Hin SIM (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Happy TAN (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)

Dmitrii GUDILIN (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering
Division, Examination Department, Moscow

Elena LUBYAKO (Ms.), Principal Examiner, Chemistry and Medicine Division, Examination
Department, Moscow

Valery MALAY (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering
Division, Examination Department, Moscow

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT ORGANISATION (EPO)

Roberto IASEVOLI (Mr.), Head, Classification Board, Rijswijk

Maarten ALINK (Mr.), Classification Board, Munich

Jérôme CARRÉ (Mr.), Classification Board, Munich

Massimo CRESCENTI (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Agnès GAMEZ MERLE (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Nathalie GEISLER (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Silvia GENNARI (Ms.), Classification Board, Munich

Ciro PERNICE (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Mark PLEHIERS (Mr.), Classification Board, Rijswijk

John RENGGLI (Mr.), Classification Board, Munich

Peter SWARÉN (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Erik TORLE (Mr.), Classification Board, Munich

Daniela VANATA (Ms.), Classification Board, Munich

Rossana VINCI (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Norbert WIENOLD (Mr.), Classification Board, Munich

IV. BUREAU/OFFICERS

président/Chair: Oliver STEINKELLNER (M./Mr.) (ALLEMAGNE/GERMANY)

vice-président/
Vice Chair Pascal WEIBEL (M./Mr.) (SUISSE/SWITZERLAND)

secrétaire/Secretary: XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ken-Ichiro NATSUME (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Assistant Director General, Infrastructure and Platforms Sector

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Director, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Senior Patent Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Olivier COLLIOUD (M./Mr.), Administrateur de projets la de la Section des systèmes informatiques, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes /Project Officer, IT Systems Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Isabelle MALANGA SALAZAR (Mme/Ms.), assistante à l'information de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Information Assistant, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

[Sigue el Anexo II]

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión
2. Aprobación del orden del día
3. Informe de la quincuagésima tercera sesión del Comité de Expertos de la CIP
Véase el documento IPC/CE/53/2.
4. Informe de la vigesimosegunda reunión del Grupo de Trabajo 1 de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral – Grupo de Trabajo sobre la Clasificación
Informe verbal de la JPO en nombre de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral.
5. Proyectos de revisión de la CIP relativos al ámbito de la mecánica
Véanse los proyectos [C 521](#), [F 089](#), [F 138](#), [F 156](#), [F 157](#), [F 162](#) y [F 163](#).
6. Proyectos de revisión de la CIP relativos al ámbito de la electricidad
Véanse los proyectos [C 505](#), [C 508](#), [C 509](#), [C 510](#), [C 511](#), [C 512](#), [C 513](#), [C 522](#), [C 523](#), [C 524](#), [F 071](#), [F 141](#), [F 142](#), [F 143](#), [F 149](#), [F 151](#), [F 159](#) y [F 164](#).
7. Proyectos de revisión de la CIP relativos al ámbito de la química
Véanse los proyectos [C 520](#), [F 082](#), [F 122](#), [F 152](#) y [F 161](#).
8. Proyectos de mantenimiento de la CIP relativos al ámbito de la mecánica
Véanse los proyectos [M 621](#), [M 634](#), [M 811](#), [M 814](#) y [M 817](#).
9. Proyectos de mantenimiento de la CIP relativos al ámbito de la electricidad
Véanse los proyectos [M 633](#), [M 815](#), [M 819](#) y [M 820](#).
10. Proyectos de mantenimiento de la CIP relativos al ámbito de la química
Véanse los proyectos [M 627](#), [M 812](#), [M 818](#) y [M 821](#).
11. Situación de la supresión de referencias no limitativas de los proyectos M 200 a M 500
Véase el proyecto [WG 191](#).
12. Próxima reunión del Grupo de Trabajo
13. Aprobación del informe
14. Clausura de la sesión

[Fin del Anexo II y del documento]